

D2FL40**400V 1.3A****特長**

- 小型SMD
- 低ノイズ
- trr=50ns

Feature

- Small SMD
- Low Noise
- trr=50ns

用途

- スイッチング電源
- DC/DC コンバータ
- フライホール
- 家電、OA、照明
- 通信、FA

Main Use

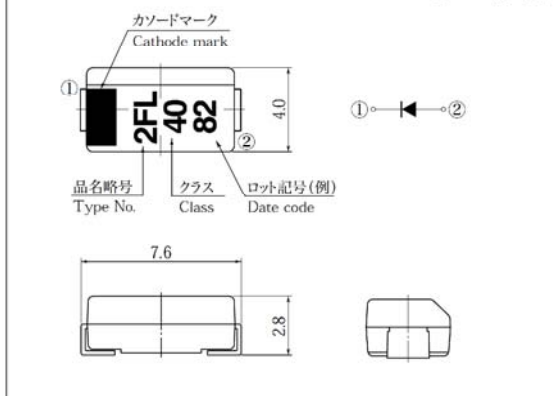
- Switching Regulator
- DC/DC Converter
- Fly Wheel
- Home Appliance, Office Automation, Lighting
- Communication, Factory Automation

■外観図 OUTLINE

Package : 2F

Unit:mm

Weight 0.16g (Typ)



外形図については新電元Webサイト又は〈半導体製品一覧表〉をご参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。

For details of the outline dimensions, refer to our web site or Semiconductor Short Form Catalog. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection".

■定格表 RATINGS**●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings** (指定のない場合 $T_I = 25^\circ\text{C}$)

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	品名 Type No.	D2FL40	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	T_{stg}			-40 ~ 150	$^\circ\text{C}$
接合部温度 Operation Junction Temperature	T_j			150	$^\circ\text{C}$
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	V_{RM}			400	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	I_o	50Hz 正弦波, 抵抗負荷, $T_a = 25^\circ\text{C}$ 50Hz sine wave, Resistance load, $T_a = 25^\circ\text{C}$	アルミナ基板実装 On alumina substrate	1.3	A
			プリント基板実装 On glass-epoxy substrate	1.05	
せん頭サージ順電流 Peak Surge Forward Current	I_{FSM}	50Hz 正弦波, 非繰り返し1サイクルせん頭値, $T_j = 25^\circ\text{C}$ 50Hz sine wave, Non-repetitive 1 cycle peak value, $T_j = 25^\circ\text{C}$		40	A

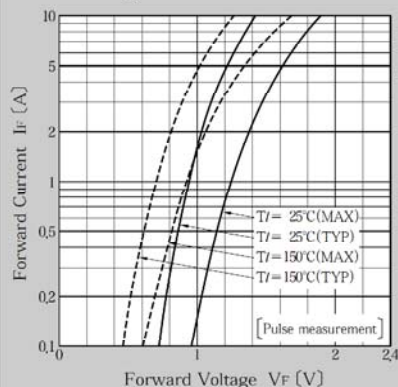
●電氣的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合 $T_I = 25^\circ\text{C}$)

順電圧 Forward Voltage	V_F	$I_F = 1.3\text{A}$, パルス測定 Pulse measurement	MAX 1.3	V
逆電流 Reverse Current	I_R	$V_R = V_{RM}$, パルス測定 Pulse measurement	MAX 10	μA
逆回復時間 Reverse Recovery Time	trr	$I_F = 0.5\text{A}$, $I_R = 1\text{A}$	MAX 50	ns
熱抵抗 Thermal Resistance	θ_{jl}	接合部・リード間 Junction to lead	MAX 24	$^\circ\text{C/W}$
	θ_{ja}	接合部・周囲間 Junction to ambient	アルミナ基板実装 On alumina substrate	MAX 90
			プリント基板実装 On glass-epoxy substrate	MAX 120

■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS

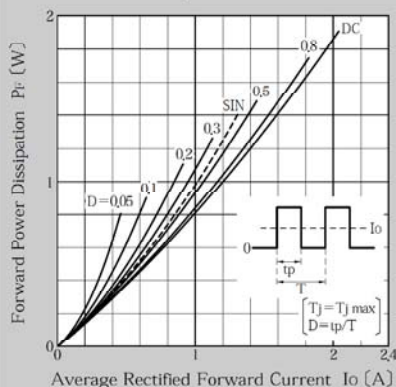
順方向特性

Forward Voltage



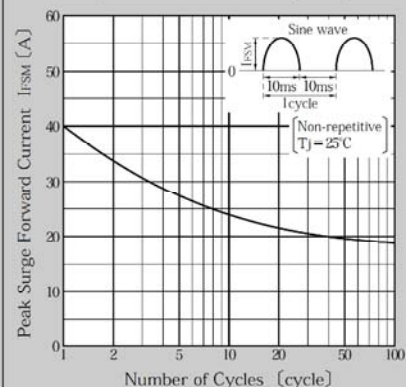
順電力損失曲線

Forward Power Dissipation



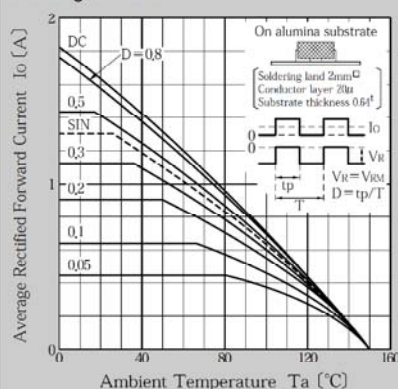
せん頭サージ順電流耐量

Peak Surge Forward Current Capability



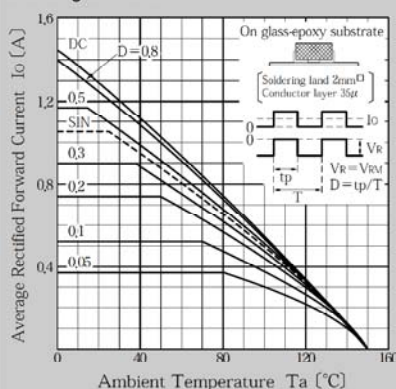
ディレーティングカーブ Ta-Io

Derating Curve Ta-Io



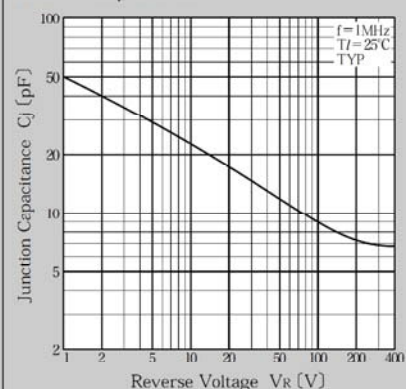
ディレーティングカーブ Ta-Io

Derating Curve Ta-Io



接合容量

Junction Capacitance



* Sine waveは50Hzで測定しています。
 * 50Hz sine wave is used for measurements.
 * 半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っています。
 Typical is a statistical average of the device's ability.
 * Semiconductor products generally have characteristic variation.
 Typical is a statistical average of the device's ability.